PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-248839

(43)Date of publication of application: 06.11.1986

(51)Int.Cl.

B65H 7/06 B65H 1/28 B65H 7/14 H01L 21/68

(21)Application number: 60-090680

(71)Applicant: NIPPON KOGAKU KK <NIKON>

(22)Date of filing:

26.04.1985

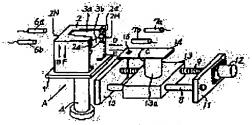
(72)Inventor: AKAGAWA KATSUYUKI

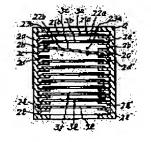
(54) TAKEOUT DEVICE FOR HOUSED WAFER

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent any damage to a wafer and a takeout arm from occurring at the time of takeout operation, by applying light to each wafer mounted on plural stages inside a carrier, while detecting the attitude.

CONSTITUTION: Each of wafers 3aW3I is horizontally placed on plural stages 2a-2a'W2I-2I' of a carrier being mounted on a pallet 1 moving in an arrow A direction, and a front opening 2M and a rear opening 2N opposed to the former are set down to a takeout port of these wafers and each passage of light out of projectors 6a and 6b parallelly set up in horizontality. When these wafers 3a and so on are righteously mounted on these stages 2a-2a', each output of light receivers 7a and 7b is largely reduced together but, for example, when the wafer 3c is placed aslant between both third and fourth stages 2c and 2d, the output of the light receiver 7a is small while the output of the light receiver 7b is large whereby it judges that an attitude of the wafer 3c is not righteous, emitting a warning and stopping other motions, and an operator remounts it for a righteous attitude.





9 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 248839

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)11月6日

B 65 H 7/06 1/28 7/14 H 01 L 21/68

7831-3F B-6827-3F 7831-3F

7831-3F 7168-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

収納ウェハの取り出し装置

②特 願 昭60-90680

20出 願 昭60(1985)4月26日

砂発 明 者 赤 川

勝幸

東京都品川区西大井1丁目6番3号 日本光学工業株式会

社大井製作所内

の出 願 人

日本光学工業株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 渡辺 降男

明 相 書

1. 発明の名称

収納ウエハの取り出し装置。

2. 特許請求の範囲

キャリア内の複数段に載置された各基板に光を 照射し、前記各基板の姿勢を検出する姿勢検査手 段を備えたことを特徴とする収納ウェハの取り出 し装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は複数の基板を収納するキャリアから基板を 1 枚ずつ取り出すウエハ取り出し装置に関する。

(発明の背景)

従来、ウエハ (基板) を収納するキャリアから 1 枚ずつウエハを取り出しこれをウエハ検査装置 に供給するものが知られている。しかしながらウ エハがキャリアに正しい姿勢で配置されていない 場合にはウエハ自身あるいはウエハを取り出す為 のアーム等を壊してしまうおそれがある。

本発明はこのような欠点を除去し、ウェハあるいはウェハを取り出す為の手段が破壊されることを防止することを目的とする。

(実施例)

第1図~第5図は本発明の実施例を示し、第1 例は実施装置の斜視図、第2図はキャリアの断面 図、第3図はブロック図、第4図及び第5図はフ ローチャートである。

第1 図において、パレット 1 は不図示の機送機構により A 方向に移動される。ウエハキヤリア 2 はパレット 1 に載置される。キヤリア 2 は第 2 図に示す如く複数の段部 2 a - 2 a', 2 b - 2 b', 2 d - 2 d'----- 3 k, 3 l c t でれぞれ段部 2 a - 2 a', 2 b - 2 b', 2 c - 2 c'---- 2 k - 2 k', 2 l - 2 l'に載置される。各段部はウエハを水平に載置するよう。 ない 3 b - - - 3 k, 3 l の取り出しを可能にする。3 b - - - 3 k, 3 l の取り出しを可能にする

開口2Mが形成され、またこれと対向する後面に も,開口2Nが形成されている。ただしこの開口 2 Nはウエハ 3 a . 3 b---- 3 Lの取り出しを阻 止する大きさである。昇降機4は機送機構により 送られてきたパレット1を上方 (B方向) へ上昇 せしめるものであり、モータ5 (第3図参) によ り駆動される。投光器 6 a, 6 b は水平方向に並 置される。受光器7a,7bも水平方向に並置さ れ、それぞれ投光器6a、6分対向する。ガイド 8とオネジ9は互いに平行となるように支持板1 0. 11に支持されている。オネジョはモータ1 2によつて支持板10.11上で回転される。ア ーム支持台13はガイド8に嵌合し、ネジ9に螺 合する。アーム14は支持台13の回転触13a を中心に C 方向に回転可能である。 アーム14は モータ15(第3図参)により駆動される。接触 センサ16はアーム14の先端に設けられている。 第3図に示す如く,前述したモータ5.12.1 5 は全て、演算処理部、メモリー部、I/O部等 からなるマイクロコンピユータ11 (以下CPU

きく波小することとなり、CPU17はウエハが 正しい姿勢で載置されていることを判別する(x)。ウエハが正しい姿勢で載置されていることを 判別すると、 C P U 1 7 は③判別出力をメモリー に記憶する。次にCPU17は④ウェハを全数チ エックしたか判別する。この場合、一枚目のウェ ハがチェツクされたばかりであるから、判別出力 は全数チェツクされていない旨の出力となる。し たがつてCPU11は⑤モータ5を作動し、昇降 機4を予め設定されたキャリアの1段分.詳しく はある段部からこの段部に隣接する別の段部に至 る距離だけ上昇せしめる。そして2段目2b-2 b°に載置されたウエハ3bが投光器6a.6b から受光器 7 a , 7 b へ至る光路内に位置づけら れる。第2図の●印22a、22bはこの時の光 路を示す。この場合,ウエハ3bは段部2b-2 b'に正しい姿勢で載置されているので再び前述 した②~⑤の工程を経て,昇降機 4 がキャリアの 1段分さらに上昇する。そしてCPU17は②の 工程へ至る。第2図の●印23a.23bはこの

と称す)により制御される。また接触センサ 1 6 及び後述する警告手段 1 8 も C P U 1 7 に接続されている。

以下第4図及び第5図のフローチャートを参照 して実施例装置の動作を説明する。

まず搬送機構によりパレット 1 が A 方向に駆動され、パレット 1 が所定位置にもたらされると、CPU 1 7 からの初期検出位置セットの指降機 4 がパレット 1 を上昇せしめ、キャリア 2 の最上段 2 a - 2 a' に載置されたウエハ 3 a が投光 6 a . 6 b から閉口 2 N . 2 M を介して受光器 7 a . 7 b の出力を取り込み、ウエハの姿勢を判別はそれを発光する。次にCPU 1 7 を 2 2 1 b はそれ投光器 6 a . 6 b から受光器 7 a . 7 b の出力と示す。すなわち第 2 図の如くの変勢で載置されていれば、受光器 7 a . 7 b の出力はともに大れていれば、受光器 7 a . 7 b の出力はともに大

時の投光器 6 a . 6 b から受光器 7 a . 7 b へ至る光路を示す。この場合は本来 3 段目 2 c - 2 c ' に載置されているはずのウェハ 3 c が 3 段目の段部 2 b ' の間に斜めに載置されている。したがつて C P U 1 7 は、受光器 7 a . 7 b の出力が大きいことより、ウェハ 3 c が正しい姿勢で載置されていないことを判別する (y)。そして C P U 1 7 は ⑧警告手段 1 8 を作動し、発音体や視覚的表示手段により警告を行なうとともにその他の動作を停止する。この場合は操作者がウェハ 3 c を段部 2 c - 2 c ' に正しい姿勢となるよう載置しなおしてやればよい。

次にウェハ3cを載置しなおした後の動作について述べる。不図示のスタートボタンを押すと、CPU17は再び①の工程に戻り、前述と同様に②~⑤の工程を繰り返し、段部2a-2a'にウェハ3aが正しい姿勢で載置されているか否かを判別する。そして次に再び

②の工程に戻る。ウエハ3 cは既に段部2 c-2 c'上にウエハ3a、3bと同様に正しい姿勢で 設置しなおされている。したがつてこの場合もう エハ3 a, 3 bの場合と同様に②~⑤の工程を経 る。そして昇降機4がキャリアの1段分さらに上 昇し、段部24-24'上に本来載置されている べきウエハの位置を、投光器6a、6bから受光 器7a.7bへ至る光路内に位置づける。しかし ながらこの段部2 d-2 d'上にはウエハが存在 していない。したがつてCPU17が②の判別動 作に移ると、受光器Ta、Tbの出力がともに大 きいことからCPU17は段郎2d-2d'上に ウェハが存在しないことを判別する (2)。そし てCPU17はの判別出力をメモリーに記憶する。 次にCPU17は②、⑤の工程を経て、再び②の 工程に戻り、 ②~⑤の工程を繰り返すことにより 各段にウエハが正しい姿勢で載置されているか否 かを判別してゆく。そして最下段のウエハ3ℓが 投光器6 a, 6 b と受光器7 a, 7 b とを結ぶ光 路内に位置づけられ、②③の工程を経て、④の工

程に至り、ウェハを全数チェックしたことを判別 すると、第5図のフローチャートにしたがつた動 作に移る。

上述した記載から明らかなように第4図のフローチャートでは、②の工程で、ウエハの姿勢が正しいと判別された場合(x)には③~⑤を経て②へ戻る。また姿勢が正しくないと判別された場合(y)には⑤へ至り警告を行なう。さらにまたウエハが存在しないと判別された場合(z)には⑦②を経て②へ戻る。

次にCPU17の第5図のフローチャートにしたがつた動作を説明する。まずCPU17がゆキャリア2に収納された全ウェハについてウェハ検査(後の工程)を終了し、この後全ウェハがキャリア2に収納されたか否かを判別する。この時点で全ウェハにつていウェハ検査が終了し、全ウェハがキャリア2に収納されていれば第5図のフローは終了する。全ウェハについてウェハ検査とのは終了する。CPU17のメモリーに蓄積され

た情報(③と⑦の判別出力)より、これから取り 出そうとするウェハが段部上に存在するか否かを 判別する。ウエハが存在しない場合は、CPU1 7が命モータ5を駆動し、昇降機 4をキャリアの 1段分下降せしめる。取り出そうとするウェハが 段部に存在すれば母の工程に移行する。この実施 例の場合にはキャリア2の最下段21-21に あるウエハ3ℓから取り出すように発定されてい る。そして最下段24-24'にはウエハが存在 する。したがつて⑩の工程の後に、CPU17が 母アーム14をセツトする旨の指令を出すと、モ ータ12が駆動され、オネジ9の回転とともに支 持台13がガイド8に案内されてD方向に移動す る。そしてアーム14が閉口3Mよりウェハ3ℓ の下、段郎21と21、の間に入り込み、停止す る。この時まだアーム14とウエハ38は接触し ていない。次にCPU17は@昇降機4を下方へ **微動する旨指令を出す。したがつてモータ5が駆** 動され、昇降機4がパレツト1及びキャリア2を 下方(F方向)へわずかに移動する。次にCPU

17は19接触センサ16から信号を取込み、セン サ16にウエハ3ℓが接触したか否かを判別する。 接触しない場合にはOに戻り、接触するまで昇降 機4の下降を繰り返す。接触したことを判別した 場合には、CPU17は®昇降機4をさらに下方 へ微動する旨の指令を出す。そして、モータ5が 駆動され、昇降機4がパレツト1及びキヤリア2 を下方(下方向)へわずかに移動する。その移動 量はウエハ3ℓが段部2ℓ−2ℓ′からわずかに 浮き,かつウエハ3ℓがその上の段節2k−2k′ に接しない程度である。こうしてウエハ3ℓがア - 4 1 4 のラエハに載置される。次に C P U 1 7 はのウェハを取り出す旨の指令を出す。したがつ てモータ12が駆動され、支持台13がB方向に 移動され、ウエハ31が取り出される。そしてさ らにモータ15が駆動され、アーム14がC方向 に回転してウエハ検査装置(不図示)にウエハ 3 2 が供給される。不図示のウエハ検査装置は供給 されたウエハについてウエハ検査を行なう。CP Ul7は®ウエハ検査装置に供給されたウエハに

ついてウエハ検査が終了したか否かを判別する。 ウエハ検査が終了していなければ所定時間ごとに この判別を繰り返す。これが待機状態である。ウ エハ検査が終了したことを判別した時点で、CP Ul7は®ウエハをキャリア2内の元の位置に収 納する。この動作はO~Oに示した動作と全く逆 の動作であるので詳述しない。こうしてウエハ検 査を終了したウエハ3ℓが元の位置(2 ℓ − 2 ℓ・ う に戻される。そしてCPU17は®の工程の最 後にモータラを駆動し、昇降機4をキャリプロ 分下降せしめる。その後、CPU17はOの工程 に戻る。上述の動作を繰り返すことによりウエハ 3 k, 3 j----のウエハ検査がなされていく。本 実施例の場合キヤリアの段部2d-2d.上には ウエハがないので、 ①の工程でウエハがないこと が判別されると、3の工程で昇降機 4 がキャリア 2の1段分下降され、①を経て再び②の工程に至 る。そして段部2c~2c、上にウエハ3cがあ ることが判別され、O以降の工程を繰り返すこと になる。最後ウエハ3aのウエハ検査が終了して

せたが、②の工程ですの判断がなされた時にCPU17がその旨をメモリーに記憶し、その後④の工程へ移行するようにしてもよい。この場合には
③の工程でウエハの存在を確認する際に、ウエハが存在しない場合と同様の処理を行なえばよい。
すなわち⑤の工程の後⑤へ移行するようにすればよい。このようにすれば姿勢の正しくないウエハに関してアームが取り出し動作を行なうことがない。したがつてウエハ自身あるいはアームが破壊されてしまうおそれがない。

上述した実施例ではキャリアがウェハを収納している場合について述べたが、キャリアがレチクルを収納していてもよい。本明細書ではウェハやレチクルを含めて基板と称す。

また上述した実施例ではキャリアから取り出したウェハをウェハ検査装置に供給したが、必ずしもウェハ検査装置に供給しなくともよい。 すなわちその他の別の装置に供給するようにしてやつてもよい。

(発明の効果)

⊕の工程を終了すると、⊕の工程へ移り、CPU 17はキャリア2に収納された全ウェハについて ウェハ検査が終了したことを判別する。こうして 第5図のフローチャートにしたがつた動作が終了 する。この後は昇降機4が下降され、搬送機構に よりパレツト1がA方向に搬送される。

上述した如く本実施例によれば、投光器及び受 光器によりキャリア内の各ウェハの姿勢を検出し、 正しい姿勢にない場合には警告を発するので、各 ウェハをアームにより取り出す時には各ウェハを それぞれ正しい姿勢に直すことができる。したが つてアームによりウェハを取り出す時に、アーム の先端が斜めに収納されたウェハの端面に当接し、 ウェハ自身あるいはアームを壊してしまうことが ない。

尚、本実施例では投光器 6 a、 6 b と受光器 7 a、 7 b と C P U 1 7 とで姿勢検査手段が構成されている。

上述した実施例では②の工程ですの判断がなされた場合に⑥の工程に移り警告手段18を作動さ

以上詳述した如く本発明によれば、キャリアから基板を取り出す際に、基板自身あるいは基板を 取り出す手段を破壊してしまうことがない。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第5図は本発明の一実施例を示し、第 1図は実施例装置の斜視図、第2図はキャリアの 断面図、第3図はブロツク図、第4図は各ウエハ の状態を検知する時のフローチャート、第5図は 各ウエハを取り出す時のフローチャートである。

(主要部分の符号の説明)

--- + + 117

	_												
;	2	a	-	2	а	٠	•	2	b	-	2	ь'	2 & - 2 & ·
													段部
į	3	a	•	3	Ъ					3	e		ウエハ
(6	a		6	Ъ								投光器
•	7	а		7	ь								受光器

出頭人 日本光学工業株式会社 代理人 渡 辺 陸 男

特開昭 61-248839 (5)

